



中华人民共和国国家标准

GB/T 22181.5—2015
代替 GB/T 11482—1989

等离子体显示器件 第 5 部分：总规范

Plasma display panels—
Part 5: Generic specification

2015-06-02 发布

2016-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义、单位、符号和缩略语	2
3.1 术语和定义	2
3.2 单位、符号和缩略语	3
4 总则	3
4.1 优先顺序	3
4.2 标准大气条件	3
4.3 标志	4
4.4 质量评定类别	4
4.5 筛选	4
4.6 操作	4
5 质量评定程序	5
5.1 总则	5
5.2 鉴定批准和/或能力批准的资格	5
5.3 初始制造阶段	5
5.4 商业保密信息	5
5.5 检验批的构成	5
5.6 结构相似器件	5
5.7 零部件	5
5.8 交货放行的有效性	5
5.9 鉴定批准试验	5
5.10 鉴定批准的授予	6
5.11 质量一致性检验	6
5.12 统计抽样程序	9
5.13 耐久性试验	9
5.14 规定失效率的耐久性试验	9
5.15 加速试验程序	10
5.16 能力批准程序	10
6 试验和测量程序	10
6.1 标准条件和一般预防措施	10
6.2 物理检查	11
6.3 电学、光学和显示性能测量	11
6.4 气候和机械试验	11
6.5 替代试验方法	11

6.6 耐久性试验	11
附录 A (规范性附录) 批允许不合格品率(LTPD)抽样方案	12
附录 B (资料性附录) 规范的基本描述	18
表 A.1 LTPD 抽样方案	13
表 A.2 等于或小于 200 的小批量超几何抽样方案	15
表 A.3 AQL 和 LTPD 抽样方案	17

前 言

GB/T 22181《等离子体显示器件》的预计结构如下：

- 第 1 部分：术语与文字符号(GB/T 22181.1—2008)；
- 第 2-1 部分：光学参数测量方法(GB/T 22181.21—2008)；
- 第 2-2 部分：光电参数测量方法(GB/T 22181.22—2008)；
- 第 2-3 部分：模块显示质量测量方法(GB/T 22181.23—2012)；
- 第 2-4 部分：数字电视机用器件特性测量方法；
- 第 3-1 部分：机械接口；
- 第 3-2 部分：电子接口；
- 第 4 部分：气候和机械试验方法；
- 第 5 部分：总规范(GB/T 22181.5—2015)；
- 第 6 部分：数字电视机用等离子体显示器件空白详细规范。

本部分是 GB/T 22181 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 11482—1989《交流等离子体显示器件总规范(可供认证用)》。本部分与 GB/T 11482—1989 相比,除编辑性修改外,主要技术性变化如下：

- 增加了术语：平均显示亮度、平均图像电平、色域覆盖率、高灰度色域覆盖率、低灰度色域覆盖率、平均功耗、视角、亮度视角、对比度视角、色度视角、动态图像分辨率、图像条纹、闪烁和噪声,及其定义(见 3.1)；
- 增加了质量评定类别、筛选和操作等内容(见 4.4、4.5 和 4.6)；
- 在质量评定程序中,修改了检验分组的划分,增加了简化检验的补充程序和 LTPD 抽样方案(见 5.11.2、5.11.4 和 5.12.2)；
- 试验项目和试验方法采用 GB/T 22181.21—2008、GB/T 22181.22—2008、GB/T 22181.23—2012 和 SJ/T 11379—2008 标准中规定的项目和方法；
- 增加了附录 A[批允许不合格品率(LTPD)抽样方案]和附录 B(规范的基本描述)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由中国电子技术标准化研究院归口。

本部分起草单位：四川虹欧显示器件有限公司、西安交通大学、四川长虹电器股份有限公司。

本部分主要起草人：邓新群、胡文波、王平松、赵晓东、王丽雯、黄长戈、唐礼。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 11482—1989。

等离子体显示器件

第5部分：总规范

1 范围

GB/T 22181 的本部分是等离子体显示器件的总规范。它规定了 IECQ-CECC 体系质量评定的通用程序,并规定了电学、光学、图像显示、机械及环境性能描述和测试的通用要求。

本部分适用于等离子体显示器件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4728(所有部分) 电气简图用图形符号

GB/T 22181.1—2008 等离子体显示器件 第1部分:术语与文字符号(IEC 61988-1:2003, IDT)

GB/T 22181.21—2008 等离子体显示器件 第2-1部分:光学参数测量方法(IEC 61988-2-1:2002, IDT)

GB/T 22181.22—2008 等离子体显示器件 第2-2部分:光电参数测量方法(IEC 61988-2-2:2003, IDT)

GB/T 22181.23—2012 等离子体显示器件 第2-3部分:模块显示质量测量方法

SJ/T 11378—2008 等离子体显示器件 第3-1部分:机械接口

SJ/T 11379—2008 等离子体显示器件 第4部分:气候和机械试验方法

IEC 60027(所有部分) 电工技术用文字符号(Letter symbols to be used in electrical technology)

IEC 60050(所有部分) 国际电工术语(International electrotechnical vocabulary)

IEC 60410:1973 计数检查抽样方案和程序(Sampling plans and procedures for inspection by attributes)

IEC 60747-1 半导体器件 第1部分:总则(Semiconductor devices—Part 1:General)

IECQ 01 电子元器件 IEC 质量评定体系(IECQ) 基本规则(IEC Quality Assessment System for Electronic components (IECQ)—Basic Rules)

IEC QC 001002:2005 (所有部分) 电子元器件 IEC 质量评定体系(IECQ) 程序规则(IEC Quality Assessment System for Electronic components (IECQ)—Rules of Procedure)

ISO 1000:1992 国际单位制及其倍数单位和一些其他单位的应用推荐(SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units)

ISO 2859-10 用属性检验的抽样程序 第10部分:介绍属性检验的抽样程序用 ISO 2859 系列标准(Sampling procedures for inspection by attributes—Part 10:Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes)

ISO 3534-2 统计学 词汇和符号 第2部分:应用统计学(Statistics—Vocabulary and symbols—Part 2: Applied statistics)